

Agenda

AK Bipolar 19.10.2000

Infineon, München

Autor	Thema
Herr Brenner (Infineon München)	Base Resistance Determination using a Double Base Contact NPN
Herr Fischer (IHP Frankfurt)	Methoden zur Bestimmung des Gütefaktors von Spulen
Herr Berkner, Herr Knoblinger (Infineon München)	1/f-Noise Measurements using a Low Noise Current Amplifier
Herr Kraus (ATMEL Heilbronn)	Simulation spannungsabhängiger Kapazitäten mit SPICE
Herr Gerhardt (Alcatel SEL Stuttgart)	Erfahrungen bei der npn-Modellierung mit Hilfe von VBIC
Herr Schröter (Technische Universität Dresden)	HICUM: Stand und Verfügbarkeit des Modells
Herr Maier (Bosch Reutlingen)	Auslesen von Daten aus einem Speicheroszi mit ICCAP
Herr Petzold (Bosch Reutlingen)	ICCAP-Transform zur Zusammenfassung von Setup-Outputs
Herr Pieper (Infineon München)	Messdatenmanagement bei skalierbaren Devices
Herr Ryczek (Philips Hamburg)	A New Bipolar Silicon On Glass Process